NARLabs 國家實驗研究院 台灣半導體研究中心

制訂日期:	2019-02-15
制訂部門:	蝕刻薄膜組
文件編號:	Q3-NL04
文件名稱:	設備作業標準(CF-T17後段真空退火爐管)

文件制修訂記錄

版本	編製者	生效日期	核定文號	改版/變更說明	修訂頁次
1.0	巫振榮	2019-02-20	IS108006	制定新版	

NARLabs 國家實	DOCUMENT NO. :		TITLE :		
台灣半導體研究中心		03-NI 04	設備作業標準		
		Q3-INL04	(CF-T17後段真空退火爐管)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 1/2 頁

一、目 的: 定義後段真空退火爐管標準作業程序,確保操作品質。

- 二、範 圍: 適用於後段真空退火爐管。
- 三、 權 責:
 1. 組織權責:工程師負責制定及修改規範。
 2. 執行人員資格:經過後段真空退火爐管考核通過之人員。
- 五、 相關文件: 無。
- 六、標準作業程序:
 - 1. 檢查機台是否標示為"運轉中"。
 - 2. 刷卡開機。
 - 3. 在控制面板上點一下,進入系統主畫面。
 - 4. 輸入密碼以登入"製程工程師"(密碼:2314)。
 - 5. 設定製程溫度(不可超過 600℃),並開啟。(設定中間的控制器即可)。
 - 6. 等待 chamber 內溫度升至所設定的溫度。
 - 7. 至控制面板,按下方的"製程執行" 後按上方的"製程執行"。
 - 8. 選擇 "高真空模式(Hi-Vac)"或 "低壓模式(LP)"。
 - 9. 確認條件設定無誤,選"確定"。
 - 10. 設定製程時間。
 - 11. 操作高真空模式者,直接進行程序13。
 - 12.操作低壓模式者:
 - (1) 設定氣體流量 (N₂ 流量<120sccm; O₂ 流量<30sccm)。
 用旋鈕調整流量值後 → 打開氣體 (gas on)。
 - (2) 設定製程壓力 (<0.3 torr)。 按 LOCAL 至燈亮→按 Pressure Mode 至燈亮→按 setpoint1 至燈亮→調整壓力值大小→按 Remote 至燈亮。

13.按 "洩氣"。

14. 將晶片置於晶舟上。

NARLabs 國家實	DOCUMENT NO. :	TITLE :			
台灣半導體研究中心		03-NI 04	設備作業標準		
		QU-INLOT	(CF-T17後段真空退火爐管)		
ISSUE DATE	2019-02-20	REVISION	1.0	PAGE	第 2/2 頁

15. 待腔門打開後,將晶舟置入 load lock chamber 內。關上 chamber 並抽氣。

- 16. 按 "温度已到達"。
- 17. 按 "開 V1 閥"。
- 18. 確認 V1 閥打開後,送入晶舟,拉桿旋轉 90 度拉出。
- 19. 按 "關 V1 閥"。
- 20. 操作高真空模式者,直接進行程序 22。
- 操作低壓模式者:
 (1)選擇 N2 或是 O2 (兩種都選會當機)。

(2)選擇氣體壓力。

- 22. 待製程結束後,按下 "製程完成"。
- 23. 按下"開 V1 閥"。
- 24. 確認 V1 閥打開後,拉桿旋轉 90 度進入 process chamber 內,拉出晶舟。
- 25. 按 "關 V1 閥"。
- 26. 按 "洩氣"。
- 27. 將製程溫度設在0℃,並關閉加熱器。
- 28. 待晶舟溫度降至室溫後,取出晶舟, 關上 load lock chamber。
- 29. 將氣體流量設在0 sccm,並關閉氣體。
- 30. 進入 "使用者別" 按下 "製程工程師",確認控制螢幕顯示 "NOT OK"。
 31. 刷卡關機。

七、應用表單及附件:

- 1. Q4-NL02 設備管理卡
- 2. Q4-NL03 設備考核表
- 3. Q4-NL04 設備點檢表
- 4. Q4-NL06 異常及矯正預防處理單